



Warszawa, dnia 19.05.2018r.

ZP/220-11/18/MR

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego pt. „Zakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska mikroskopów odwróconych z wyposażeniem do dokumentacji badań”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyniku pytań zadanych przez wykonawców:

Pytanie nr 1.

Dotyczy XIV. 1 tabela „parametry techniczne” – zakres tonalny, co jeśli producent nie podaje – jakiej formy potwierdzenia zakresu wymaga Zamawiający?

Odpowiedz:

Do otrzymania punktów za ten parametr wymagane jest potwierdzenie przez Wykonawcę, że zaoferowany sprzęt spełnia to wymaganie.

Pytanie nr 2.

Dotyczy XIV. 1 tabela „parametry techniczne”

- a) Czy zamawiający może zrezygnować z korekcji grubości szkła do 2 mm i dopuścić 1,5mm dla obiektywów 20x i 40x jako punktowaną? Używane obecnie w mikroskopach odwróconych do prac nad organizmami wodnymi naczynia nie osiągają takich wartości jak 2 mm.
- b) Czy zamawiający dopuści obiektyw 20x o aperturze 0,4 jako punktowany?
- c) Czy zamawiający dopuści równoważny lub lepszy obiektyw 20x Ph2, jako punktowany?
- d) czy zamawiający dopuści dla obiektywu 40x odległości roboczej 2,5 do 3,3 mm jako punktowany?
- e) czy zamawiający dla obiektywu 10x wymaga by obiektyw był oznaczony jako Long Distance (LD lub LWD), czy przyjmie tylko parametr odległości roboczej wyrażony w mm, jeśli tak to jaki?
- f) Czy zamawiający może zrezygnować z punktowania obiektywu 10x za parametr „semiplanapochromatyczny fluorytowy” skoro nie zamawia dla mikroskopu ani fluorescencji ani kontrastu Nomarskiego dla tego powiększenia, a tylko te techniki wymagałyby użycia szkieł fluorytowych? W przypadku jasnego pola i kontrastu fazowego apertura decyduje o zdolności rozdzielczej obiektywu, a więc o jakości obrazu i tylko apertura powinna być punktowana.

Odpowiedz.

Pyt. a), b), c), d) – Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt e) - Tak. Wymagany jest obiektyw oznaczony jako LongDistance.



Pyt. f) – Tak. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tabeli Liczba punktów w kryterium „parametry techniczne”, Parametry techniczne podlegające ocenie.

Zapis:

Obiektywy	Obiektywy 20x albo 40x semiplanapochromatyczne fluorytowe, korygowane na nieskończoność, typu Long Distance z korekcją grubości szkła w przedziale 0-2 mm, do obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym. Parametry nie gorsze niż 20x NA 0,45 WD8,2-6,9mm i 40x NA 0,6 WD3,6-2,8mm Obiektyw 10x semiplanapochromatyczny, fluorytowy, typu Long Distance, do jasnego pola i kontrastu fazy Ph1, nie gorszy niż 10x NA 0,3, WD 14mm
-----------	--

Zastępuje się zapisem:

Obiektywy	Obiektywy 20x albo 40x semiplanapochromatyczne fluorytowe, korygowane na nieskończoność, typu Long Distance z korekcją grubości szkła w przedziale 0-2 mm, do obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym. Parametry nie gorsze niż 20x NA 0,45 WD7,5-6,5mm i 40x NA 0,6 WD3,6-2,8mm Obiektyw 10x semiplanapochromatyczny, typu Long Distance, do szkiełek o grubości do 1 mm , do jasnego pola i kontrastu fazy Ph1, nie gorszy niż 10x NA 0,3, WD 9,5mm
-----------	---

Pytanie nr 3.

Dotyczy XIV. 1 tabela „parametry techniczne”

Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu.

Czy Zamawiający zrezygnuje z bardzo wysokiego punktowania za wymienione w SIWZ parametry oprogramowania, jako możliwe do spełnienia tylko przez jednego wykonawcę i przyjmie zapisy proponowane przez nas w pytaniu do załącznika 10 do SIWZ, Tabela 2.- oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu poniżej:

Wymagania szczegółowe dla urządzeń. Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu.

W zaproponowanym przez Zamawiającego oprogramowaniu duży nacisk stawia się na pracę z obrazem „na żywo”, który wg naszego doświadczenia i doświadczenia wielu użytkowników jest opcją wspomagającą obserwację i umożliwiającą wstępne pomiary. Aby wyniki pomiarów (w tym zliczania) były miarodajne i istniała możliwość zweryfikowania poprawności wyników jedynym skutecznym sposobem jest pomiar na zdjęciu z naniesionymi adnotacjami. Zdjęcie takie zawiera jednocześnie dane liczbowe i dowodzi obrazem, że pomiaru dokonano poprawnie. Chcąc udokumentować większy obszar preparatu, a nie tylko uzyskany przez pole widzenia kamery można posłużyć się opcją składania obrazów w osiach X, Y z pojedynczych zdjęć. Tego typu wielkoformatowe zdjęcie z naniesionymi adnotacjami jest rzetelnym dokumentem jakości wykonanych pomiarów.

Ponadto, podczas pracy z obrazem „na żywo” zachodzi możliwość przemieszczania obserwowanych obiektów (szczególnie podczas obserwacji obiektów w zawieszynie) i niebezpieczeństwo ponownego dokonania pomiaru, szczególnie przy oczekiwanych przez Zamawiającego 65 klasach obiektów. Obserwator nie ma też pewności czy przejrzały wszystkie obszary preparatu i zliczone wszystkie obiekty. Oczekiwanie kilkudziesięciu (40 do 65) klas obiektów w tego typu badaniach wydaje się nie znajdować zastosowania w tego typu badaniach.

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie o następujących parametrach:



Komplet oprogramowania do akwizycji i analizy obrazu współpracujące z ww. kamerą w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny wraz z licencją bezterminową powinno umożliwiać:

- Wyświetlanie obrazu mikroskopowego „na żywo” na monitorze komputera
- Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania
- Automatyczną i ręczną kontrolę ekspozycji i balansu bieli
- Zmiany parametrów obrazu: kontrastu, jasności, nasycenia, balansu kolorów RGB z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie,
- Obróbkę graficzną zdjęć
- Zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe
- Pomiary odległości (poziome, pionowe i w dowolnie określanych kierunkach), kątów, pól powierzchni, obwodów itp. w jednostkach metrycznych. Wszystkie pomiary na obrazie „na żywo” i na zdjęciu. W trakcie pomiaru wyświetlana adnotacja o aktualnej wartości pomiaru, zmieniającej się wraz z przeciąganiem znacznika.
- Możliwość dokonywania pomiarów wraz z automatyczną aktualizacją danych w wyniku dokonywania kolejnych pomiarów i edycji pomiarów na zdjęciach. Podgląd wyników i ich edycja bez potrzeby generowania kolejnych tabel i przenoszenia danych do arkuszy kalkulacyjnych. Usunięcie elementów pomiarowych z ekranu monitora nie może powodować utraty danych. Możliwość tworzenia i usuwania rekordów oraz ich sortowania.
- Nanoszenie na obraz „na żywo” elementów umożliwiających zliczanie zaznaczonych obiektów wraz informacją na obrazie „na żywo” o ilości zliczonych elementów. Możliwość edycji elementów umożliwiających zliczanie (kolor, nazwa, wielkość itp.). Możliwość uzyskania po utrwaleniu obrazu tabeli z informacjami na temat naniesionych adnotacji tj. nazwa i ilość zliczanych elementów.
- Nanoszenie na zdjęcia elementów umożliwiających zliczanie zaznaczanych obiektów wraz z podglądem w tabeli ilości zaznaczonych obiektów. Możliwość definiowania nieograniczonej ilości klas elementów dla zliczanych obiektów.
- Nanoszenie na obraz „na żywo” oraz zdjęcie siatki pomiarowej z możliwością dowolnego edytowania wielkości pól oraz skali pozwalającej na dowolną edycję miejsca wyświetlania wraz z trwałym umieszczeniem na zdjęciach. Odcinek skali musi być edytowalny o skok dostosowany do zadanego w oprogramowaniu obiektywu.
- Możliwość gromadzenia i edycji pomiarów na obrazie „na żywo” i na zdjęciu. Usunięcie z ekranu elementów pomiarowych i do zliczania obiektów nie może skutkować utratą wyników, które w efekcie finalnym zostaną wyświetlone i zapisane w tabeli
- Zmiany obiektywów w oprogramowaniu podczas obserwacji „na żywo” nie powinny wymagać zatrzymywania działania programu i nie mogą powodować destabilizacji jego działania.
- Podczas obserwacji „na żywo” zmiana obiektywów w oprogramowaniu powinna być skorelowana z naniesionymi danymi pomiarowymi na obrazie, aby wraz z softwarową zmianą obiektywu zmieniała się odpowiednio skala danych pomiarowych pokazując tym samym rzeczywistą wartość.
- Przenoszenie uzyskanych danych do arkuszy kalkulacyjnych, generowanie raportów PDF.
- Nanoszenie na zdjęcia adnotacji, strzałek, opisów, skal
- Separacja kolorów obrazu na pojedyncze składowe RGB
- Zapis wraz z obrazem ustawień kamery oraz kalibracji
- Zapis sekwencji filmowych
- Zapis zdjęć minimum w formatach jpg, bmp, tiff, format natywny (wszystkie zapewnione)
- Składanie obrazów w osiach X, Y z pojedynczych zdjęć przy zachowaniu wszystkich parametrów optycznych
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły
- Język oprogramowania: angielski lub polski.



Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tabeli 2 Wymagania szczegółowe dla urządzeń, Wymagania minimalne.

Zapis:

Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu	<p>Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu współpracujące z ww. kamerą w oparciu o 64-bitowy system operacyjny wraz z licencją bezterminową powinno umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wyświetlanie obrazu mikroskopowego „na żywo” na monitorze komputera- Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania- Automatyczną i ręczną kontrolę ekspozycji i balansu bieli- Zmiany parametrów obrazu: kontrastu, jasności, nasycenia, balansu kolorów RGB z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie,- Obróbkę graficzną zdjęć- Zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe- Pomiary odległości (poziome, pionowe i w dowolnie określanych kierunkach), kątów, pól powierzchni, obwodów itp. w jednostkach metrycznych. Wszystkie pomiary na obrazie „na żywo”, na zdjęciu i obrazie „zamrożonym”. W trakcie pomiaru wyświetlana adnotacja o aktualnej wartości pomiaru, zmieniającej się wraz z przeciągnięciem znacznika. Podgląd uzyskiwanych wyników.- Możliwość obliczania średniej, minimum, maksimum wykonywanych pomiarów wraz z automatyczną aktualizacją danych w wyniku dokonywania kolejnych pomiarów i edycji pomiarów. Podgląd wyników i ich edycja bez potrzeby generowania kolejnych tabel i przenoszenia danych do arkuszy kalkulacyjnych. Usunięcie elementów pomiarowych z ekranu monitora nie może powodować utraty danych. Możliwość przywracania i usuwania rekordów oraz ich sortowania- Nanoszenie na obraz „na żywo” oraz na zdjęcia elementów umożliwiających zliczanie zaznaczonych obiektów. Elementy w kolejnych polach widzenia powinny pozwalać na sumowanie się i automatyczną aktualizację wyników oraz ich podgląd. Możliwość definiowania elementów dla minimum 40 klas zliczanych obiektów.- Nanoszenie na obraz „na żywo”, zdjęcie, „zamrożenie” siatki pomiarowej z możliwością dowolnego edytowania wielkości pól oraz skali pozwalającej na dowolną edycję miejsca wyświetlania wraz z trwałym umieszczeniem na zdjęciach. Odcinek skali musi być edytowalny o skok maksymalnie 10 µm lub dowolną wartość- Program musi zapewniać gromadzenie i edycję danych w obrazie „na żywo” i na zdjęciu. Usunięcie z ekranu elementów pomiarowych i do zliczania obiektów nie może skutkować utratą wyników wyświetlanych i zapisywanych w tabelach
--	---



	<ul style="list-style-type: none"> - Zmiany obiektywów w obrazie „na żywo” nie powinny wymagać zatrzymywania działania programu i nie mogą powodować destabilizacji jego działania. - Zmiana obiektywów powinna być skorelowana z tabelą z wyświetlonymi danymi pomiarowymi aby bez względu na powiększenie dane zawarte w tabeli pokazywały rzeczywiste wartości. - Statystyka pomiarów przedstawiona liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach - Przenoszenie uzyskanych danych do arkuszy kalkulacyjnych, generowanie raportów PDF. - Możliwość tworzenia makr - Nanoszenie na zdjęcia adnotacji, strzałek, opisów, skal - Separacja kolorów obrazu na pojedyncze składowe RGB - Morfologiczna separacja obiektów, operacja arytmetyczna na obrazach kolorowych i binarnych - Zapis wraz z obrazem ustawień kamery oraz kalibracji - Zapis sekwencji filmowych - Zapis zdjęć minimum w formatach jpg, bmp, tiff, format natywny (wszystkie zapewnione) - Składanie obrazów w osiach x, y pojedynczych zdjęć przy zachowaniu wszystkich parametrów optycznych - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły - Język oprogramowania: angielski
--	---

Zastępuje się zapisem:

<p>Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu</p>	<p>Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu współpracujące z ww. kamerą w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny wraz z licencją bezterminową powinno umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyświetlanie obrazu mikroskopowego „na żywo” na monitorze komputera - Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania - Automatyczną i ręczną kontrolę ekspozycji i balansu bieli - Zmiany parametrów obrazu: kontrastu, jasności, nasycenia, balansu kolorów RGB z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie, - Obróbkę graficzną zdjęć - Zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe - Pomiary odległości (poziome, pionowe i w dowolnie określanych kierunkach), kątów, pól powierzchni, obwodów itp. w jednostkach metrycznych. Wszystkie pomiary na obrazie „na żywo” i na zdjęciu. W trakcie pomiaru wyświetlana adnotacja o aktualnej wartości pomiaru.
---	--



zmieniającej się wraz z przeciągnięciem znacznika.

- Możliwość dokonywania pomiarów wraz z automatyczną aktualizacją danych w wyniku dokonywania kolejnych pomiarów i edycji pomiarów na zdjęciach oraz obrazie na żywo. Podgląd wyników i ich edycja bez potrzeby generowania kolejnych tabel i przenoszenia danych do arkuszy kalkulacyjnych. Usunięcie elementów pomiarowych z ekranu monitora nie może powodować utraty danych. Możliwość tworzenia i usuwania rekordów oraz ich sortowania.
- Nanoszenie na obraz „na żywo” elementów umożliwiających zliczanie zaznaczonych obiektów wraz z informacją o ilości zliczonych elementów. Możliwość edycji elementów umożliwiających zliczanie (np. kolor, nazwa, wielkość, kształt itp.). Możliwość uzyskania tabeli z informacjami na temat naniesionych adnotacji tj. nazwa i ilość zliczanych elementów.
- Nanoszenie na zdjęcia elementów umożliwiających zliczanie zaznaczanych obiektów wraz z podglądem w tabeli ilości zaznaczonych obiektów. Możliwość definiowania kilkudziesięciu klas elementów dla zliczanych obiektów.
- Nanoszenie na obraz „na żywo” oraz zdjęcie siatki pomiarowej z możliwością dowolnego edytowania wielkości pól oraz skali pozwalającej na dowolną edycję miejsca wyświetlania wraz z trwałym umieszczeniem na zdjęciach. Odcinek skali musi być edytowalny o skok dostosowany do zadanego w oprogramowaniu obiektywu lub dowolną wartość.
- Możliwość gromadzenia i edycji pomiarów na obrazie „na żywo” i na zdjęciu. Usunięcie z ekranu elementów pomiarowych i do zliczania obiektów nie może skutkować utratą wyników, które w efekcie finalnym zostaną wyświetlone i zapisane w tabeli.
- Zmiany obiektywów w oprogramowaniu podczas obserwacji „na żywo” nie powinny wymagać zatrzymywania działania programu i nie mogą powodować destabilizacji jego działania.
- Podczas obserwacji „na żywo” zmiana obiektywów w oprogramowaniu powinna być skorelowana z danymi pomiarowymi, aby wraz z softwarową zmianą obiektywu zmieniała się odpowiednio skala danych pomiarowych pokazując tym samym rzeczywistą wartość.
- Przenoszenie uzyskanych danych do arkuszy kalkulacyjnych, generowanie raportów PDF.
- Nanoszenie na zdjęcia adnotacji, strzałek, opisów, skal
- Separacja kolorów obrazu na pojedyncze składowe RGB
- Zapis wraz z obrazem ustawień kamery oraz kalibracji
- Zapis sekwencji filmowych
- Zapis zdjęć minimum w formatach jpg, bmp, tiff, format natywny (wszystkie zapewnione)
- Składanie obrazów w osiach X, Y z pojedynczych zdjęć przy zachowaniu wszystkich parametrów optycznych



	<ul style="list-style-type: none"> - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły - Język oprogramowania: angielski lub polski
--	--

Pytanie nr 4.

Dotyczy Załącznik 10 do SIWZ, Tabela 2 „ Statyw”

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania konfiguracji pracy bez zmian konstrukcyjnych w technice kontrastów modulacyjnych z wyłączeniem ciemnego pola? Technika ciemnego pola w mikroskopach odwróconych jest używana wyłącznie przy obserwacji w świetle odbitym. Najczęściej mikroskopy do obserwacji w świetle odbitym używane są w materiałoznawstwie.

- Uchwyt rewolwerowy obiektywów min. 6 gniazdowy z miejscami na wsuwki do kontrastu DIC dla min. trzech obiektywów – czy Zamawiający dopuści 5 gniazdowy skoro zamawia tylko 4 obiektywy?

- Kondensator 6-cio pozycyjny - czy Zamawiający dopuści 5-cio pozycyjny, który również będzie nadmiarowy (podobnie jak 6-cio pozycyjny) i wystarczający do funkcjonowania zamawianego wyposażenia mikroskopu

Odpowiedz.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tabeli 2 Wymagania szczegółowe dla urządzeń, Wymagania minimalne.

Zapis:

Statyw	<ul style="list-style-type: none"> - Możliwość zastosowania konfiguracji pracy w technice ciemnego pola i kontrastów modulacyjnych bez zmian konstrukcyjnych. - Uchwyt rewolwerowy obiektywów min. 6 gniazdowy z miejscami na wsuwki do kontrastu DIC dla min. trzech obiektywów
--------	--

Zastępuje się zapisem:

Statyw	<ul style="list-style-type: none"> - Możliwość zastosowania konfiguracji pracy w technice kontrastów modulacyjnych bez zmian konstrukcyjnych. - Uchwyt rewolwerowy obiektywów min. 5 gniazdowy z miejscami na wsuwki do kontrastu DIC dla min. dwóch obiektywów
--------	---

Zapis:

Kondensator	<ul style="list-style-type: none"> - Kondensator „Long Distance” 6-cio pozycyjny, z regulowaną przysłoną aperturową, N.A. 0,40, odległość robocza min. 30 mm, do jasnego pola, kontrastu fazowego, kontrastu Nomarskiego DIC bez potrzeby montażu/demontażu elementów.
-------------	--

Zastępuje się zapisem:

Kondensator	<ul style="list-style-type: none"> - Kondensator „Long Distance” 5-cio pozycyjny, z regulowaną przysłoną aperturową, N.A. 0,40, odległość robocza min. 30 mm, do jasnego pola, kontrastu fazowego, kontrastu Nomarskiego DIC bez potrzeby montażu/demontażu elementów.
-------------	--



Pytanie nr 5.

Czy zamawiający zgodzi się na dodanie zwrotu „na wezwanie Zamawiającego” w zdaniu: „Wykonawca Zamówienia zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnego, jednodniowego szkolenia aplikacyjnego dla odbiorców końcowych – pracowników WIOŚ lub ich Delegatur, w zakresie eksploatacji i wykorzystania mikroskopu oraz praktycznego zastosowania aplikacji do obsługi mikroskopu i kamery (wymiar nie mniejszy niż 8 godzin lekcyjnych) przeprowadzone w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia...”

Odpowiedz.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru Wykonawca ustala z Zamawiającym dogodny termin szkolenia.

Pytanie nr 6.

Dotyczy zał. nr 7 do SIWZ. Wzór umowy. § 9, punkt 1, podpunkt 2.

Czy zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej do poziomu 0,2 %

Odpowiedz.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7.

Dotyczy Załącznik nr 10 do SIWZ, Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń. Monitor.

Czy Zamawiający rozszerzy możliwość połączenia monitora z komputerem o złącze HDMI?

Odpowiedz.

Tak, zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Zapis:

Złącza	Połączenie z komputerem przez złącze DVI lub Display Port
--------	---

Zastępuje się zapisem:

Złącza	Połączenie z komputerem przez złącze DVI lub Display Port lub HDMI
--------	---

Pytanie nr 8.

Dotyczy Załącznik nr 10 do SIWZ, Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń. Monitor.

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie lub dodania sformułowania „nie wymagany” do opisu „Obrotowa podstawa monitora”. Rozwiązanie to jest rzadko spotykane wśród producentów monitorów. Ponadto możliwość tej regulacji monitora jest praktycznie nie używane przez użytkowników.

Odpowiedz:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 9.

Dotyczy Załącznik nr 10 do SIWZ, Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń. Monitor. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie lub dodania sformułowania „nie wymagany” do opisu „Regulacja wysokości monitora”. Przy monitorach o ekranie 25” i większym rozwiązanie to jest proponowane przez producentów sporadycznie ze względu na małą potrzebę takiej regulacji przy tak dużych monitorach.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiający usuwa zapis dotyczący spełniania wymogu regulacji wysokości monitora.

Pytanie nr 10.

Dotyczy Załącznik nr 10 do SIWZ, Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń.

Komputer do zestawu mikroskopu z kamerą i zbierania danych

Zamawiający określił komputer jako „Komputer do zestawu mikroskopu z kamerą i zbierania danych” więc poza podłączeniem zewnętrznych nośników danych Zamawiający nie przewiduje lub nie dopuszcza podłączenia nowych urządzeń. Zamawiający wymaga procesora osiągającego w teście wydajnościowym PassMark PerformanceTest co najmniej 10.000 punktów wg. kolumny Passmark CPU Mark. Nie widzimy uzasadnienia do zastosowania procesora o tak dużej mocy obliczeniowej do urządzeń opisanych przez Zamawiającego. Pozostałe wymagania związane z komputerem nie wskazują na konieczność użycia architektury serwerowej, a tym samym tak zaawansowanego procesora.

W związku z powyższym kierujemy do Zamawiającego pytanie o dopuszczenie procesora osiągającego w teście wydajnościowym PassMark PerformanceTest co najmniej 6 000 punktów wg. kolumny Passmark CPU Mark.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tabeli 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń, Wymagania minimalne.

Zapis:

Procesor	Procesor klasy x 64, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark PerformanceTest co najmniej 10.000 punktów wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (aktualny wynik z 2018 r. - z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu – wydruk w załączeniu). Należy podać wynik testu oraz podać nazwę procesora. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zaoferowane komponenty komputera nie będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SIWZ.
----------	---

Zastępuje się zapisem:

Procesor	Procesor klasy x 64, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark PerformanceTest co najmniej 6.000 punktów wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (aktualny wynik z 2018 r. - z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu – wydruk w załączeniu). Należy podać wynik testu oraz podać nazwę procesora. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zaoferowane
----------	--



	komponenty komputera nie będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SIWZ.	
--	---	--

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchylnej nasadki trinokularowej z regulacją kąta nachylenia w zakresie 10-40 stopni, z regulacją międzyżreniczną w zakresie 55-75mm?

Odpowiedz na pytanie:

Tak, zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tabeli 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń, Wymagania minimalne.

Zapis:

Tubus	<ul style="list-style-type: none"> - Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic, stały kąt w zakresie 35-45 stopni, pole widzenia min. 22 mm, rozstaw okularów 50-75mm - Wbudowany w tubus port kamery cyfrowej lub aparatu, podział światła 50:50% - Możliwość wstawienia modułu pośredniego z portem bocznym dla kamery dla łatwej rozbudowy o kamerę, z podziałem światła 50/50% lub 0/100% - Dopuszcza się tubus bez portu kamery jeżeli kamera została podłączona przez boczny port z podziałem światła co najmniej 100:0 i 20:80. W tej sytuacji nie jest wymagany dodatkowy moduł pośredni z portem bocznym.
-------	---

Zastępuje się zapisem:

Tubus	<ul style="list-style-type: none"> - Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic, stały kąt w zakresie 35-45 stopni, pole widzenia min. 22 mm, rozstaw okularów 50-75mm. Dopuszcza się uchylną nasadkę trinokularową z regulacją kąta nachylenia w zakresie 10-40 stopni, z regulacją międzyżreniczną w zakresie 55-75mm - Wbudowany w tubus port kamery cyfrowej lub aparatu, podział światła 50:50% - Możliwość wstawienia modułu pośredniego z portem bocznym dla kamery dla łatwej rozbudowy o kamerę, z podziałem światła 50/50% lub 0/100% - Dopuszcza się tubus bez portu kamery jeżeli kamera została podłączona przez boczny port z podziałem światła co najmniej 100:0 i 20:80. W tej sytuacji nie jest wymagany dodatkowy moduł pośredni z portem bocznym.
-------	---

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnych, wysokiej klasy obiektywów o długości optycznej 45mm i korekcji apochromatycznej o następujących parametrach:



- a) 10x, Plan Fluoryt, z korekcją semi-apochromatyczną, dostosowany do obserwacji w kontraście fazowym Ph1, NA=0.32, WD=11.13mm, pozwalające na obserwację przez szkło grubości do 0,17 mm;
- b) 20x, Plan Fluoryt z korekcją semi-apochromatyczną, dostosowany do obserwacji w kontraście fazowym Ph1 , NA=0,4, WD=6,9 mm, pozwalające na obserwację przez szkło grubości 0-2 mm;
- c) 40x, Plan Fluoryt z korekcją semi-apochromatyczną, dostosowany do obserwacji w kontraście fazowym Ph2, NA=0,6, WD=3,3-1,9 mm, pozwalające na obserwację przez szkło grubości 0-2 mm;
- d) 63x, Plan Fluoryt z korekcją semi-apochromatyczną, przystosowany do kontrastu Nomarskiego (DIC), NA=0,7, WD=2,6 mm, pozwalające na obserwację przez szkło grubości 0,1-1,3 mm

Proponowane obiektywy w żadnym stopniu nie odbiegają klasą ani jakością od wymaganych, a zmiany wynikają z różnic technologicznych pomiędzy wiodącymi producentami optyki.

Odpowiedz:

Dot. pkt a) - Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Dot. pkt b), c), d) - Tak. Zamawiający w SIWZ w tabeli nr 2 Wymagania szczegółowe dla urządzeń w wymaganiach minimalnych zawarł zapis dopuszczający zaoferowanie obiektywu o podanych parametrach.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tabeli 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń, Wymagania minimalne.

Zapis:

Obiektywy	<p>Obiektyw planachromatyczny lub wyższej klasy, typu Long Distance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10x/apertura 0,25, kontrast fazowy Ph1, pozwalające na obserwację przez szkło grubości do 1 mm, WD 8,5mm <p>Obiektywy semiplanapochromatyczny lub wyższej klasy, fluorytowy, korygowany na nieskończoność, typu Long Distance z korekcją grubości szkła w przedziale min. 0-1,5 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20x / apertura 0,4, kontrast fazowy Ph1, WD 8,4-7,4mm - 40x /apertura 0,60, kontrast fazowy Ph2, WD 3.3 - 2.5mm - 60 lub 63x /apertura 0,7, WD 2.2 – 1.2mm, obiektyw przystosowany do kontrastu Nomarskiego (DIC), dopuszcza się obiektyw z regulacją grubości szkiełka w zakresie min. 0,1-1,3m.
------------------	--

Zastępuje się zapisem:

Obiektywy	<p>Obiektyw planachromatyczny lub wyższej klasy, typu Long Distance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10x/apertura 0,25, kontrast fazowy Ph1, pozwalające na obserwację przez szkło grubości do 1 mm. <p>Obiektywy semiplanapochromatyczny lub wyższej klasy, fluorytowy, korygowany na nieskończoność, typu Long Distance z korekcją grubości szkła w przedziale min. 0,1-1,3 mm:</p>
------------------	--



	<ul style="list-style-type: none">- 20x / apertura 0,4, kontrast fazowy Ph1,- 40x /apertura 0,60, kontrast fazowy Ph2,- 60 lub 63x /apertura 0,7, WD 2.2 – 1.2mm, obiektyw przystosowany do kontrastu Nomarskiego (DIC).
--	--

Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery:

- z przetwornikiem CMOS 1/2”;
- o rozdzielczości 5,0 mln efektywnych pixeli;
- czasie ekspozycji 0,5 ms do 500 msek.;
- digitalizacji 24 bitów,
- szybkości transmisji obrazów 30 fps przy maksymalnej rozdzielczości;
- interface danych USB 2.0;
- z adapterem c-mount dostosowany optymalnie do przetwornika kamery

Odpowiedz na pytanie:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

W konsekwencji wprowadzonych zmian modyfikacji ulegają również zapisy SIWZ w pkt XIV ust. 1 b) „liczba punktów w kryterium parametry techniczne”, w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” oraz w załączniku nr 10 do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”

Zaktualizowane załączniki udostępnione zostały na stronie internetowej GIOŚ.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 15.06.2018r.

W konsekwencji w pkt XII SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” ust. 2 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa dnia: 15.06.2018r. o godz. 10:30.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 15.06.2018r. o godz. 11:00 w pokoju 434.”

W związku z powyższym kopertę, w której złożona zostanie oferta należy opisać w następujący sposób:

„Nie otwierać przed dniem 15.06.2018r., do godz. 11:00”

Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące.

GLÓWNY INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

dr inż. Marek Haliniak